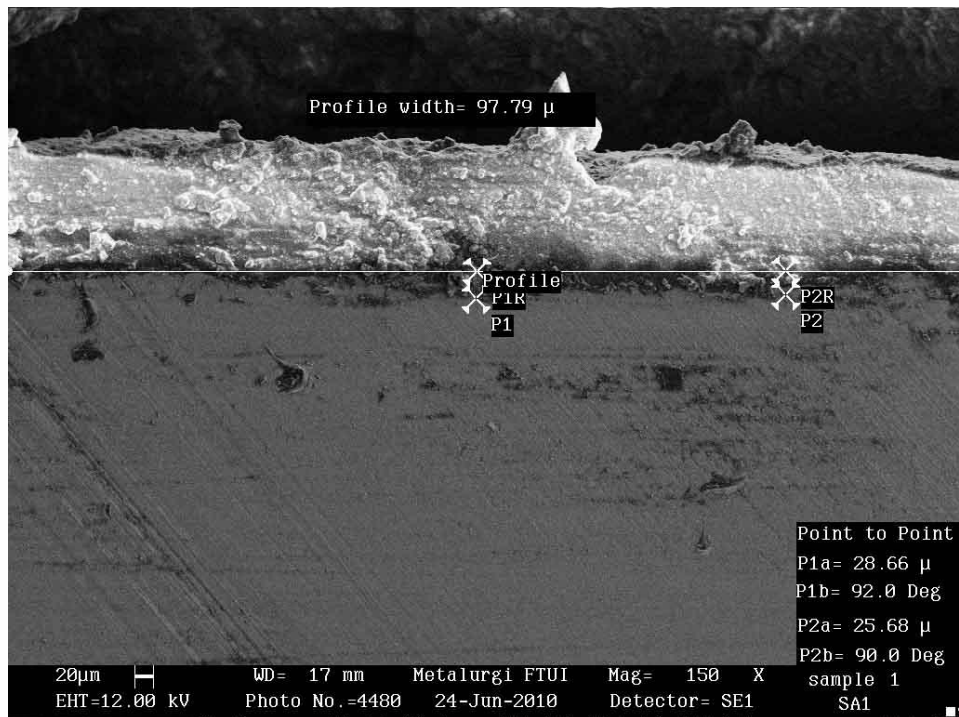
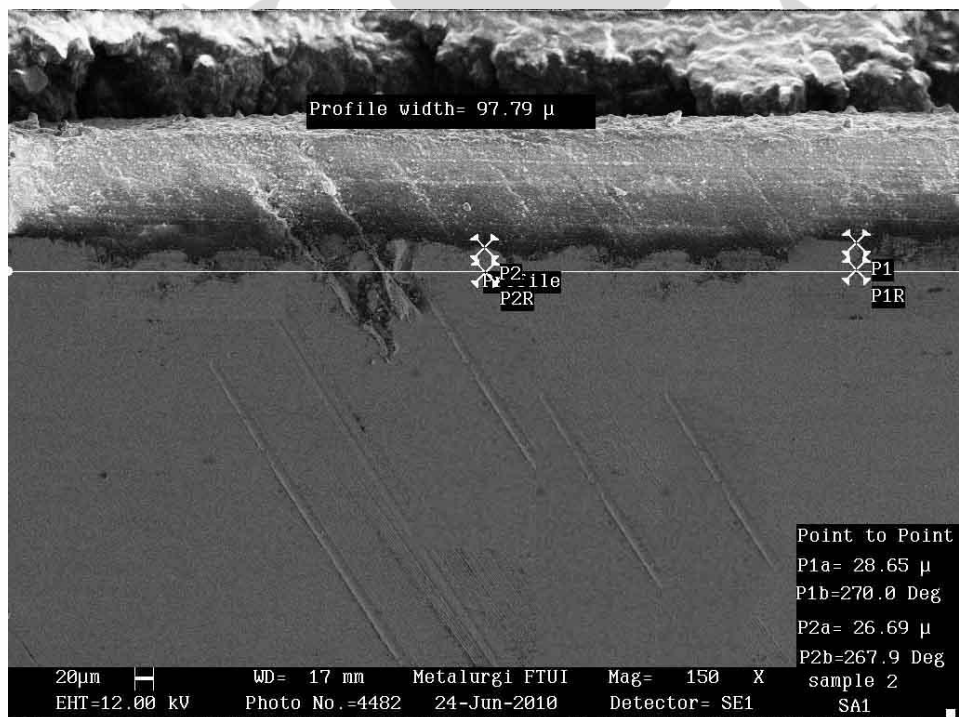


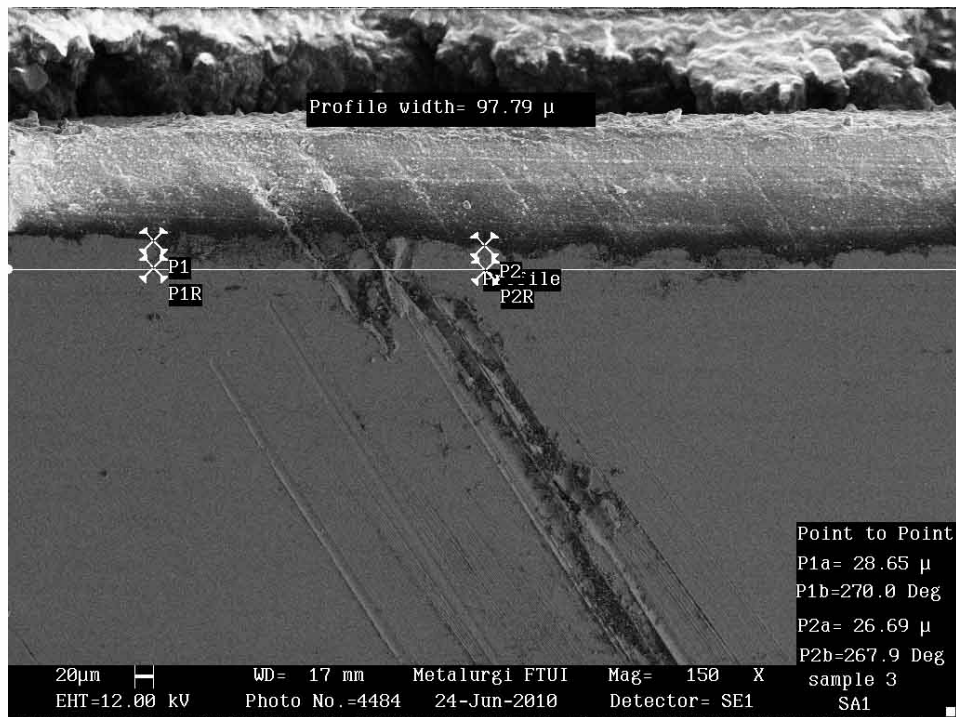
Lampiran 1 Pencitraan SEM untuk variasi preparasi permukaan sampel



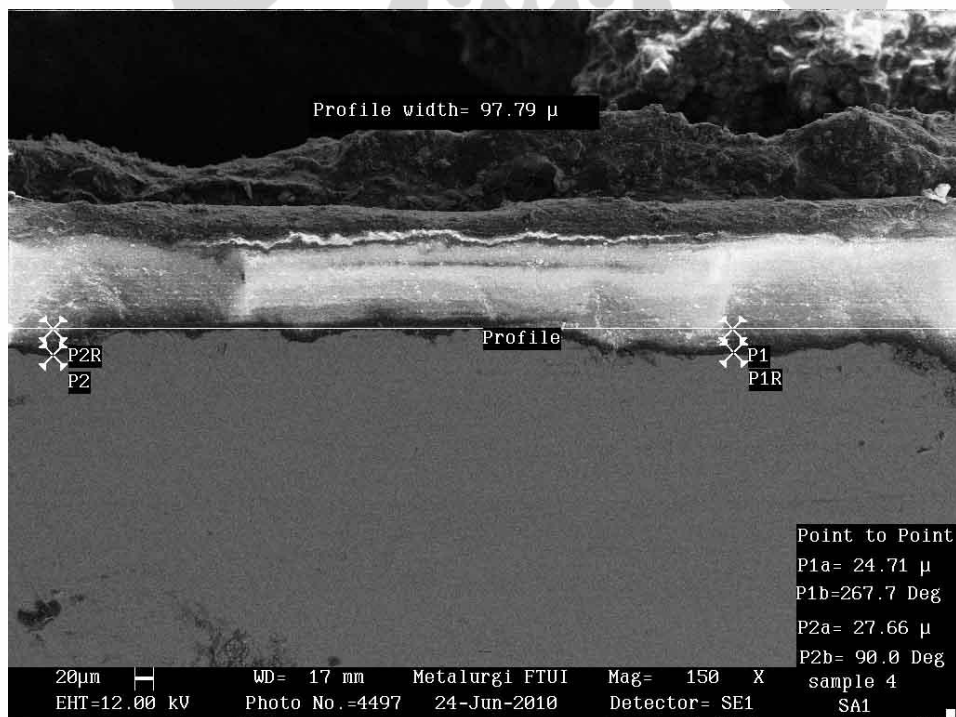
Gambar 1. Hasil uji SEM Sampel 1, pembesaran 150X pada profil permukaan SP7



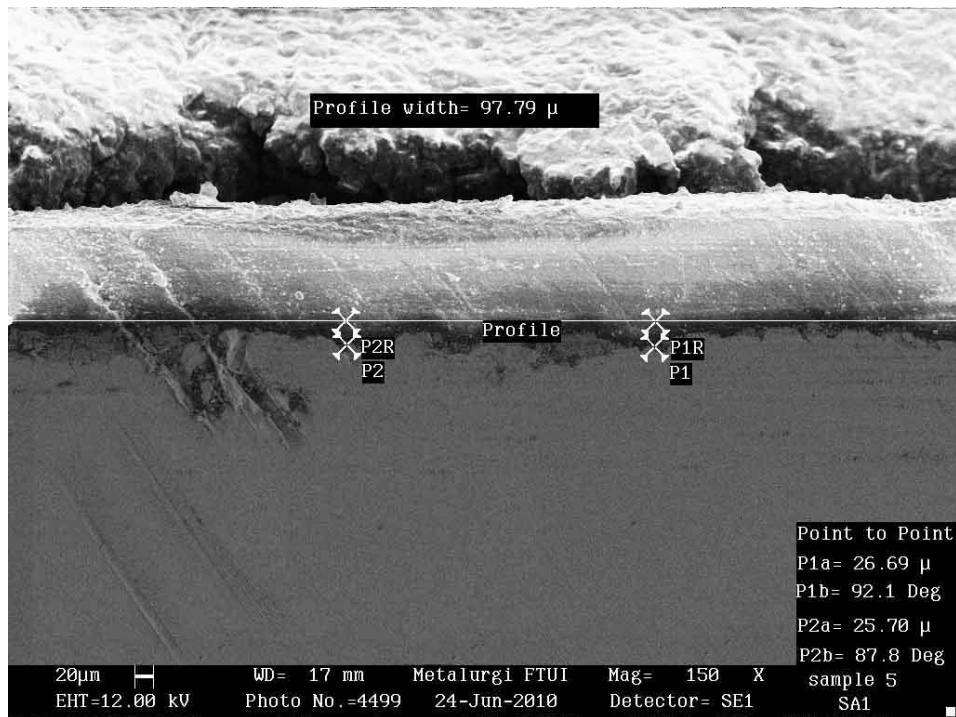
Gambar 2. Hasil uji SEM Sampel 2 ,pembesaran 150X pada profil permukaan SP7



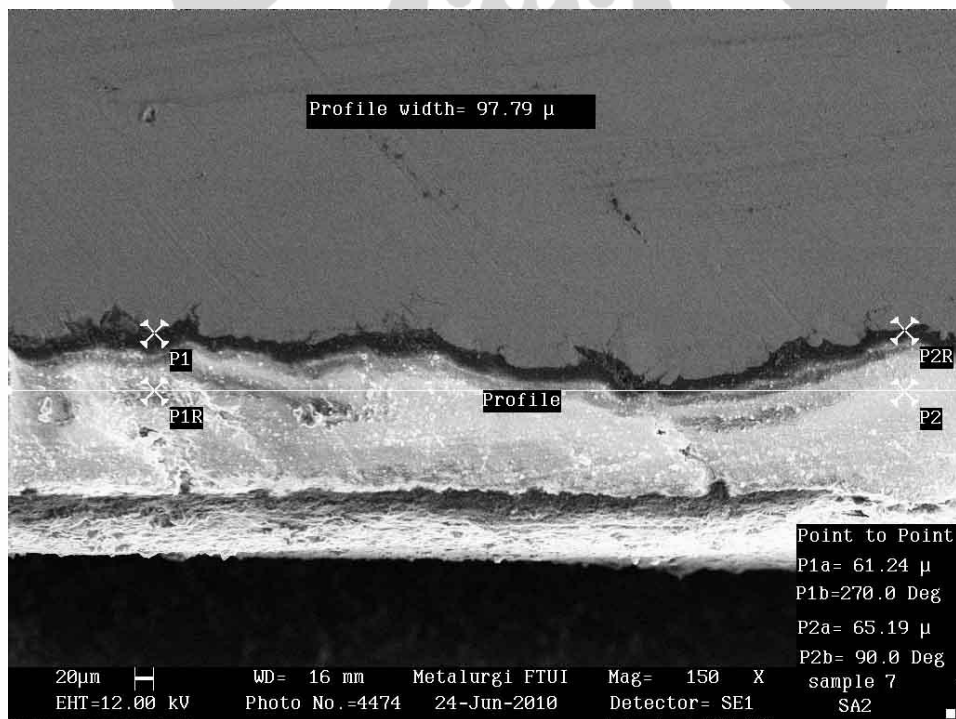
Gambar 3. Hasil uji SEM Sampel 3, pembesaran 150X pada profil permukaan SP7



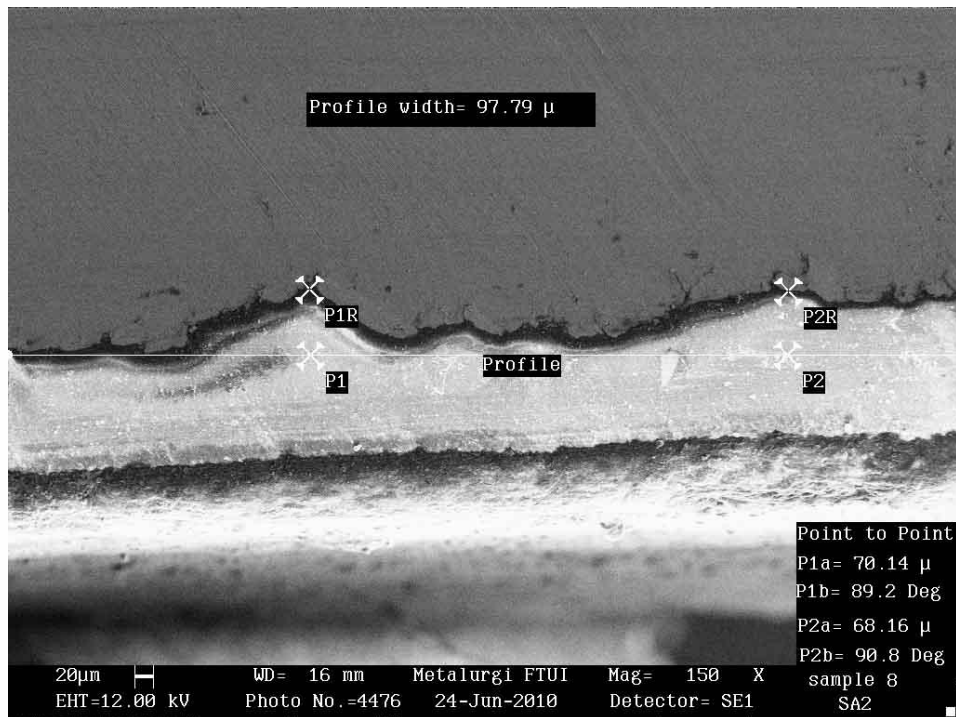
Gambar 4 Hasil uji SEM Sampel 4 ,pembesaran 150X pada profil permukaan SP7



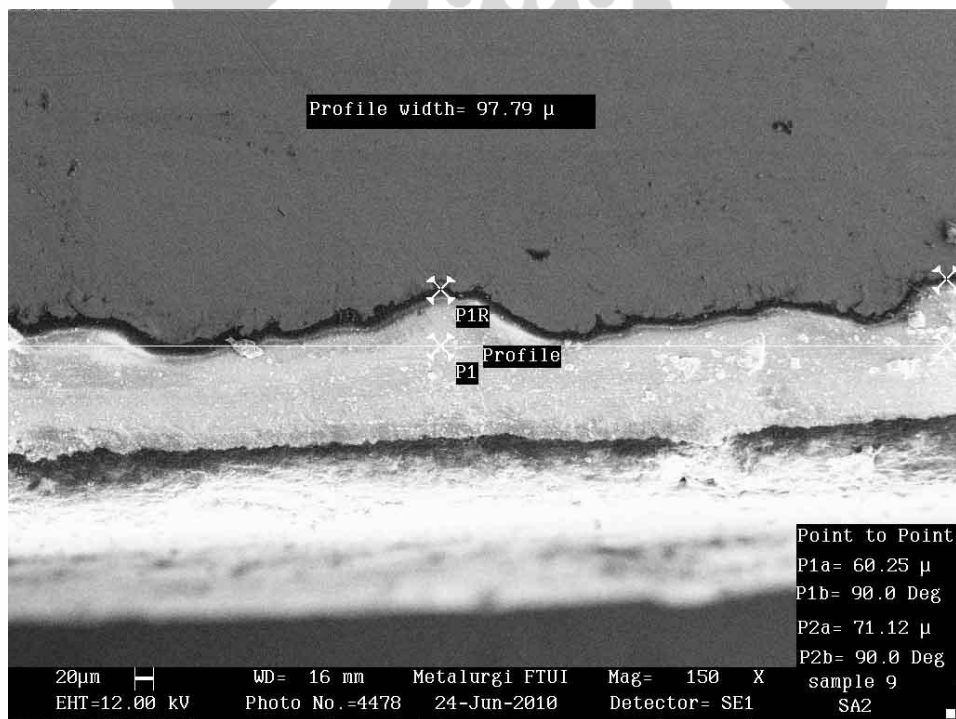
Gambar 5. Hasil uji SEM Sampel 5, pembesaran 150X pada profil permukaan SP7



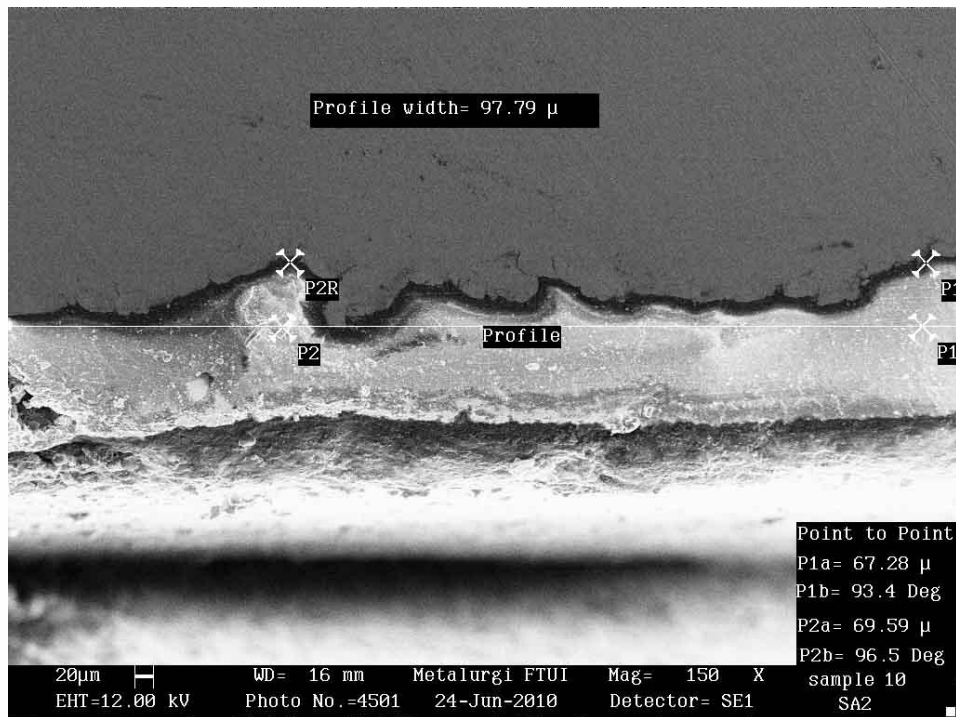
Gambar 6. Hasil uji SEM Sampel 7 ,pembesaran 150X pada profil permukaan SP6



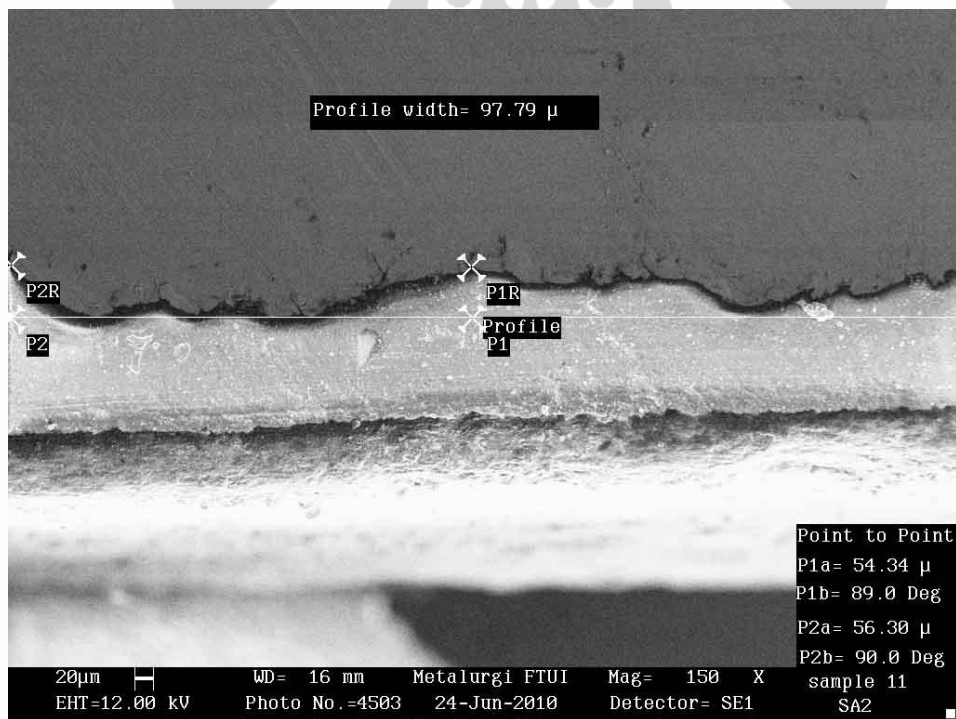
Gambar 7. Hasil uji SEM Sampel 8, pembesaran 150X pada profil permukaan SP6



Gambar 8. Hasil uji SEM Sampel 9 ,pembesaran 150X pada profil permukaan SP6

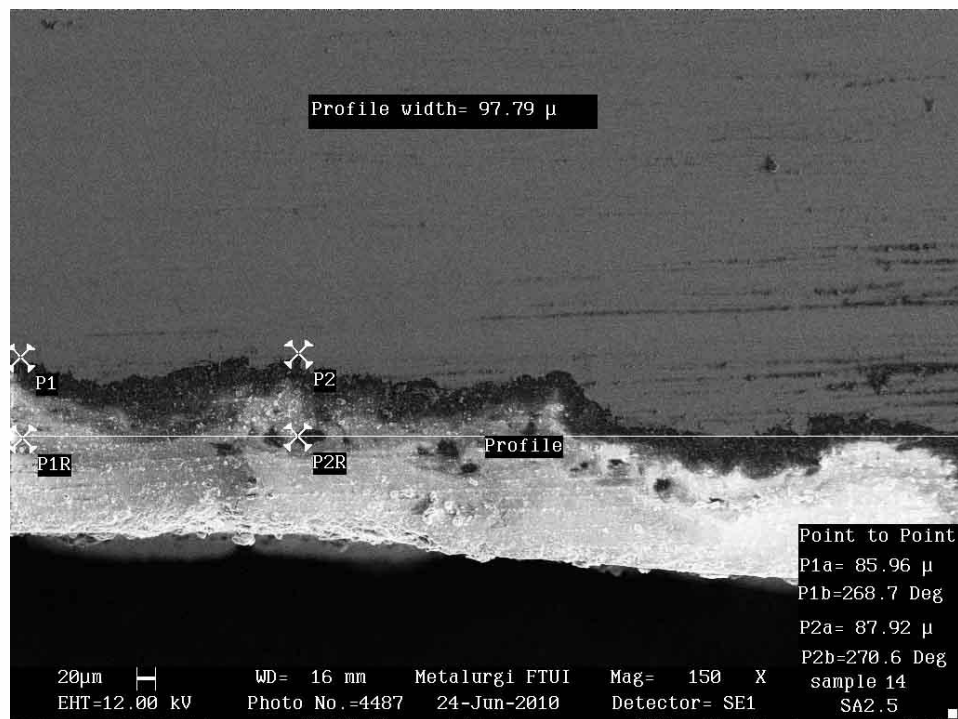


Gambar 9. Hasil uji SEM Sampel 10, pembesaran 150X pada profil permukaan SP6

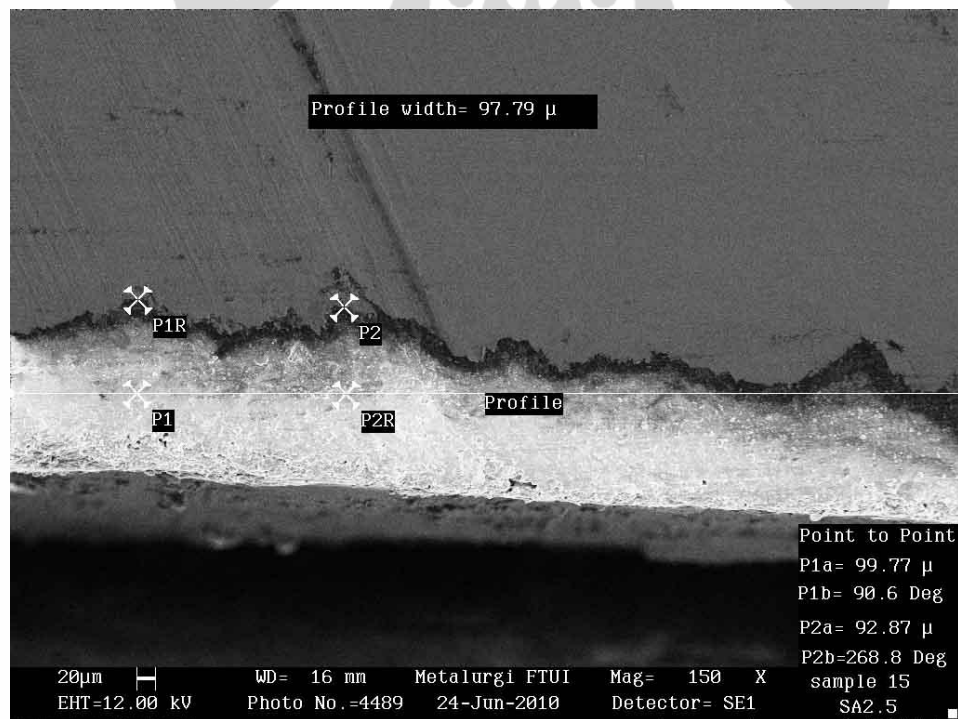


Gambar 10. Hasil uji SEM Sampel 11 ,pembesaran 150X pada profil permukaan SP6

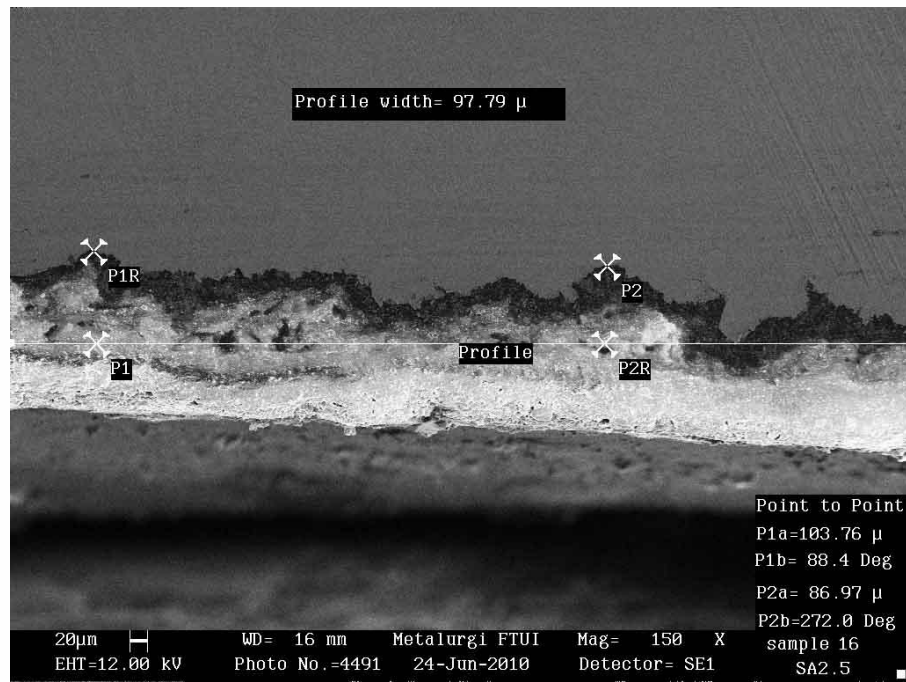




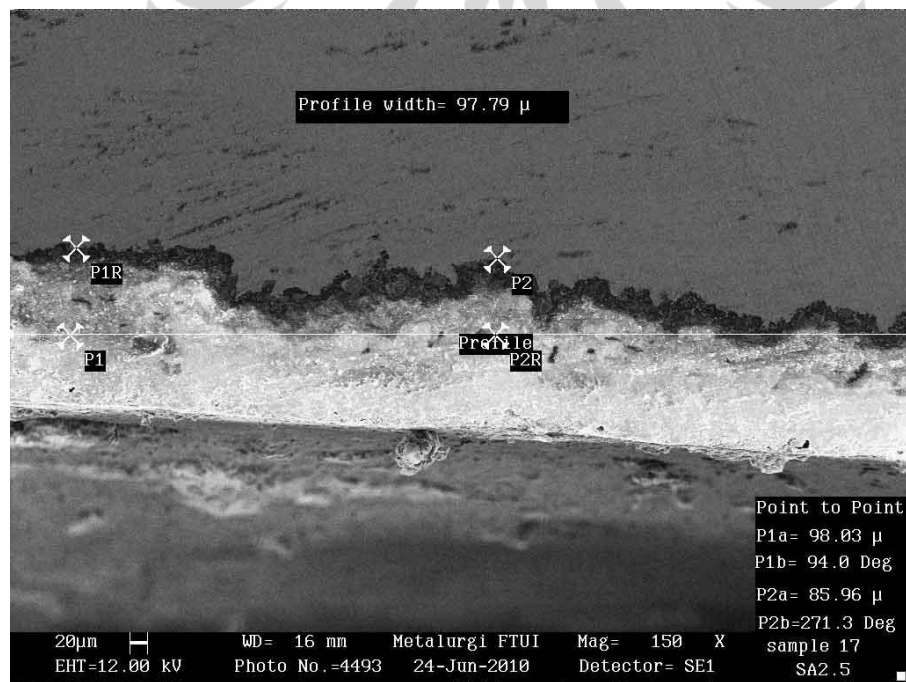
Gambar 11. Hasil uji SEM Sampel 14, pembesaran 150X pada profil permukaan SP10



Gambar 12. Hasil uji SEM Sampel 15 ,pembesaran 150X pada profil permukaan SP10



Gambar 13. Hasil uji SEM Sampel 16, pembesaran 150X pada profil permukaan SP10



Gambar 14. Hasil uji SEM Sampel 17, pembesaran 150X pada profil permukaan SP10



Gambar 15. Hasil uji SEM Sampel 18, pembesaran 150X pada profil permukaan SP10